PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-031616

(43) Date of publication of application: 02.02.1996

(51)Int.CI.

H01C 7/10

H01C 1/142

(21)Application number: 06-167952

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

20.07.1994

(72)Inventor: MATSUYAMA YOSHIO

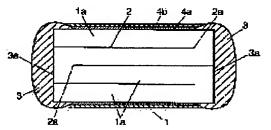
WAKAHATA YASUO TOKUNAGA HIDEAKI

(54) VARISTOR AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To enhance the plating—resistance and damp—proof property by a method wherein an electrode is formed on the surface of a varistor element, a mixture mainly composed of SiO2 is provided on the surface of the varistor element and fired, and a high resistance layer mainly composed of Zn—Si—O is formed on the part which is not covered by the electrode of the surface of the varistor element.

CONSTITUTION: A ceramic sheet 1a, which is mainly composed of ZnO, and an inner electrode 2 are laminated, Ag paste is coated on both edge faces of a fired varistor element 1, and an electrode is baked. Then, when the varistor 1 is embedded and fired in the mixture which is mainly composed of SiO2 the main component ZnO of the varistor element 1 and SiO2 are reacted with each other, and a high resistance layer 4a mainly composed of Zn2SiO4 is formed on the surface of the element 1. Also when Bi2O3, is added as a subcomponent to the varistor element 1, Bi2O3 is reacted with SiO2 and the high resistance layer 4a, mainly composed of Zn2O2, is formed on the surface of the varistor element 1 and a high resistance layer 4b, mainly composed of Bi4(SiO4)3, is formed thereon.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.10.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3453857 [Date of registration] 25.07.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-31616

(43)公開日 平成8年(1996)2月2日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01C 7/10 1/142

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特顏平6-167952	(71)出顧人 000005821
(22)出顧日	平成6年(1994)7月20日	松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
		(72)発明者 松山 美穂 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(72)発明者 若畑 康男 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(72)発明者 徳永 英晃 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(74)代理人 弁理士 小鍜治 明 (51.2名)

(54) 【発明の名称】 パリスタとその製造方法

(57) 【要約】

【目的】 バリスタ素子表面に、耐湿性、耐メッキ性に 優れた高抵抗層を有するバリスタを提供することを目的 とするものである。

【構成】 バリスタ素子1の表面にSiO2を主成分とする混合物15を配し、焼成することにより、バリスタ素子1の表面に、2n-Si-O系の物質からなる高抵抗層4aを形成するものである。

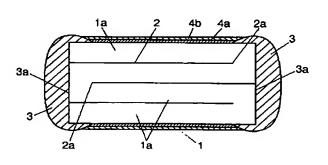
1 バリスタ素子

2 内部電極

2a 遊端

3 外部電極

3a, 4a, 4b 高抵抗層



.

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ZnOを主成分とするバリスタ素子と、前記バリスタ素子の表面に設けた電極と、前記バリスタ素子表面の少なくとも前記電極に覆われていない部分に設けた髙抵抗層とを備え、前記髙抵抗層はZn-Si-O系の物質を主成分とするバリスタ。

【請求項2】 バリスタ素子と、前記バリスタ素子の表面に設けた電極と、前記バリスタ素子表面の少なくとも前記電極に覆われていない部分に設けた第1の高抵抗層と、前記第1の高抵抗層の上に設けた第2の高抵抗層とを備え、前記バリスタ素子は2nOを主成分とし、副成分として少なくともBiを含有し、前記第1の高抵抗層は2n-Si-O系の物質を主成分とし、前記第2の高抵抗層はBi-Si-O系の物質を主成分とするバリスタ。

【請求項3】 バリスタ素子と、前記バリスタ素子の表面に設けた電極と、前記バリスタ素子表面の少なくとも前記電極に覆われていない部分に設けた第1の高抵抗層と、前記第1の高抵抗層の上に設けた第2の高抵抗層とを備え、前記バリスタ素子は2nOを主成分とし、副成 20分として少なくともBを含有し、前記第1の高抵抗層は2n-Si-O系の物質を主成分とし、前記第2の高抵抗層はB-Si-O系の物質を主成分とするバリスタ。

【請求項4】 バリスタ素子と、前記バリスタ素子の表面に設けた電極と、前記バリスタ素子表面の少なくとも前記電極に覆われていない部分に設けた第1の高抵抗層と、前記第1の高抵抗層の上に設けた第2の高抵抗層とを備え、前記バリスタ素子はZnOを主成分とし、副成分として少なくともBi, Bを含有し、前記第1の高抵抗層はZn-Si-O系の物質を主成分とし、前記第2の高抵抗層はBi-Si-O系の物質と、B-Si-O系の物質とを主成分とするバリスタ。

【請求項5】 バリスタ素子と、前記バリスタ素子の内部に設けた内部電極と、前記バリスタ素子の両端面に、前記内部電極と電気的に接続するように設けた外部電極と、前記バリスタ素子表面の少なくとも前記電極で覆われていない部分に設けた高抵抗層とを備え、前記内部電極の遊端に対向する前記外部電極の前記バリスタ素子側面に高抵抗層を設けたバリスタ。

【請求項6】 ZnOを主成分とする原材料を成形して バリスタ素子を得、次に前記バリスタ素子表面に電極を 形成し、次に前記バリスタ素子の表面にSiO2を主成 分とする混合物を配して焼成し、前記バリスタ素子の表 面に高抵抗層を形成するバリスタの製造方法。

【請求項7】 ZnOを主成分とする原材料を成形して バリスタ素子を得、次に前記バリスタ素子の表面に第1 の電極を形成し、次に前記バリスタ素子の表面にSiO 2を主成分とする混合物を配して焼成し、前記バリスタ 素子表面に高抵抗層を形成後、前記第1の電極上に第2 の電極を形成するバリスタの製造方法。 【請求項8】 ZnOを主成分とする原材料を成形して バリスタ素子を得、次に前記バリスタ素子の表面にSiO2を主成分とする混合物を配して焼成して前記素子表 面に高抵抗層を形成し、次に前記バリスタ素子の表面に 電極を形成するバリスタの製造方法。

【請求項9】 ZnOを主成分とする原材料を成形して バリスタ素子を得、次に前記バリスタ素子を、ケイ素化 合物を含む液体に浸漬し、その後、前記バリスタ素子を 焼成して、前記バリスタ素子の表面に高抵抗層を形成す るバリスタの製造方法。

【請求項10】 ケイ素化合物として、(CH3O)4Si, (C2H5O)4Si, (C3H7O)4Si, (C4H9O)4Siのうち少なくとも一種類以上を用いる請求項9記載のバリスタの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はバリスタとその製造方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来より、チップ部品は半田付け時に半田により、Ag外部電極が、侵されてしまうため、Ag外部電極の上にNiメッキ等を施し、この上からさらに、半田付け性向上のため半田メッキを施している。しかし、ZnOバリスタは、半導体であるため電解メッキを行うと、セラミック素子表面もメッキされてしまうので、これを防ぐために、セラミック素子表面にSi,B,Bi,Pb,Ca等からなるガラスをディップして、高抵抗層を形成していた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、ガラスによる 高抵抗層は選択的にセラミック素子表面だけに形成する ことができず、また均一な厚さにすることが困難であっ た。このため、メッキをするときメッキ流れをおこして ショートしたり、水分等がセラミック素子内部に浸入し てバリスタ特性を劣化させたりするという問題点を有し ていた。

【0004】そこで本発明は、緻密で均一な厚みを有し、選択的にセラミック素子表面に高抵抗層を形成し、耐メッキ性、耐湿性に優れたバリスタを提供することを目的とするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するために、本発明はバリスタ素子の表面に電極を形成し、次にバリスタ素子の表面にSiO2を主成分とする混合物を配し、その後焼成し、バリスタ素子表面の少なくとも電極に覆われていない部分に主成分がZn-Si-O系の物質である高抵抗層を形成するものである。

[0006]

【作用】この構成により、バリスタ素子表面のZnO成 50 分がSiO2と反応し、バリスタ素子表面に主成分がZ

n-Si-O系の物質である高抵抗層が形成される。しかし、バリスタ素子表面に設けられた電極とSiO2は反応しないので選択的に電極形成部分を除く、バリスタ素子表面に、高抵抗層が形成され、前記電極上にメッキすることができる。また、この高抵抗層は、緻密で均一な厚みを有するので、メッキ流れや余分な水分などが浸入するのを防ぐことができるので、耐湿性、耐メッキ性に優れたバリスタを得ることができる。

【0007】さらに、積層型のバリスタの場合、外部電極とバリスタ素子の間にも、高抵抗層が形成されるので、内部電極の遊端と、対向する外部電極の距離を短くすることができる。すなわち、内部電極の面積を大きくすることができるので、サージ耐量の大きなバリスタを得ることができる。

【0008】なお外部電極のバリスタ素子側面に高抵抗層が形成される理由は、現時点で明確になっていないが、バリスタ素子の成分とSiO2とが反応して液相化し、界面から液相化した高抵抗成分が素子内に浸入するためであると思われる。

[0009]

【実施例】

(実施例1)図1において、1はバリスタ素子で、その内部にはAg製の内部電極2が複数設けられている。これらの内部電極2には、交互にバリスタ素子1の両端に引き出され、その両端において、外部電極3と電気的に接続されている。

【0010】また、内部電極2間、及びその外側に積層されたセラミックシート1aは、ZnOを主成分とし、 副成分としてBi2O3, Co2O3, MnO2, Sb 2O3, B2O3等を含んでいる。

【0011】図2は製造工程を示し、セラミックシート 1 a は図2において(5)で示すごとく原料の混合、粉 砕、スラリー化、シート成形により作製した。次にこの セラミックシート1 a と、内部電極2とを積層(6) し、それを切断(7)し、930℃で30分間焼成

(8)後、シェーカーで1時間、セラミック素子1の表面の面取(9)をした。

【0012】次に、セラミック素子1の両端面にAg電極ペーストを塗布(10)し、750 \mathbb{C} ~ 850 \mathbb{C} で Ag 電極焼付(11)し、その後、図3 に示すごとくSi O2 を主成分とする混合物15 にバリスタ素子15 を埋没させ、空気中あるいは酸素雰囲気中で750 \mathbb{C} ~ 950 \mathbb{C} \mathbb{C} ~ 950 \mathbb{C} ~ 5 ~ 10 ~ 10

【0013】この焼成により、バリスタ素子1の主成分 ZnOと、SiO2が反応して、主にZn2SiO4から なる高抵抗層4aが前記バリスタ素子1表面上に形成さ れる。また、バリスタ素子1に副成分として、Bi2O3 を添加した場合、Bi2O3がSiO2と反応して、主に Zn2SiO4からなる高抵抗層4aと、この高抵抗層4 aの上に、主にBi4(SiO4)3からなる高抵抗層4b とがバリスタ素子1の表面上に形成される。

【0014】また、バリスタ素子1の副成分としてB2 O3を添加した場合、B2O3がSiO2と反応して、主に Zn2SiO4からなる高抵抗層4aと、この上に、主に B2(SiO4)3からなる高抵抗層4bとがバリスタ素子 1の表面上に形成される。

【0015】さらに、バリスタ素子1に、副成分とし て、Bi₂O₃とB₂O₃とを添加した場合、Bi₂O₃とB 2O3とがSiO2と反応して、主にZn2SiO4からな る高抵抗層 4 a と、この上に、主にB i 4 (S i O 4) 3 と B2(SiO4)3とからなる高抵抗層4bとがバリスタ素 子1の表面上に形成される。これら反応により生じた物 質は、バリスタの特性への悪影響は生じず、バリスタと して極めて特性の優れたものが得られる。ここで重要な ことは、図3に示すごとく個々のバリスタ素子1を全て SiО2を主成分とする混合物15に埋没させておくこ とである。そのために、まずアルミナのるつぼ16の中 に所定の厚さでSiO2を主成分とする混合物15を敷 きつめ、その上に、バリスタ素子1を隣接するものと接 20 触しないように並べ、その状態でSiO2を主成分とす る混合物15を充分に覆いかぶせた。この状態で焼成を 行った後に、バリスタ素子1表面と、外部電極3表面の SiO2を主成分とする混合物15を取り除いた。この 除去は例えば容器内にSiCの玉石と純水とバリスタ素 子1とを入れて撹拌したり、エアーガンで複数のバリス タ素子1を容器内で揺動させたりして行った。その後、 外部電極3表面に2A, 30minで電解Niメッキ、そ の上に 0. 6A, 30minで半田メッキ (図2の14) を行い、バリスタを得た。

(0 【0016】得られたバリスタの断面から、メッキの厚みは、Niメッキが1.2μm、半田メッキは1.3μmであった。

【0017】また、耐メッキ性を調べ(表1)に示した。

[0018]

【表1】

	メッキ液による パリスク素子の腐食	メッキ流れ
従来例コート無し	腐食される	100%
従 来 例コート有り	局部的に腐食される	7~8%
本 発 明	腐食されない	0%

(注)メッキ流れとは素子表面上にメッキがされること

【0019】(表1)に示すように、高抵抗層4a,4bを有していないバリスタ素子1にメッキを行うと、外部電極3の形成部分以外のバリスタ素子1の表面積の100%がメッキされてしまう。

50 【0020】また、従来のように、バリスタ素子1の表

40

面にガラスによる高抵抗層を形成したものは、7~8% メッキされた。しかし、本実施例によるものは、バリス タ素子1の外部電極3形成部分以外は全くメッキされな かった。

【0021】また、本発明のバリスタは、メッキ時も、メッキ液による、バリスタ素子1の腐食が起きないので、優れた特性を有するものである。

【0022】 (実施例2) 実施例1と同様にして、外部 電極3塗布 (10) 後のバリスタ素子1を、図3に示すごとく、SiO2を主成分とする混合物15に、埋没させ、この状態で、 $750\sim950$ ℃で5分 ~10 時間焼成した。その後、外部電極3上に、さらにAg電極ペーストを塗布し、 $750\sim850$ ℃で $10\sim60$ 分間Ag電極焼付を行い、次にメッキ(14)を行ってバリスタを得た。

【0023】また、実施例2においてSiO2を主成分とする混合物15にバリスタ素子1を埋没させて反応させた後、外部電極3上についたSiO2の反応物は実施例1と同様に除去してから、さらに外部電極3の上にAgを塗布して焼付てもよい。

【0024】実施例1と同様に、実施例2においても、バリスタ素子1の主成分2 n O と、S i O2が反応して、主に2 n 2 S i O4 からなる高抵抗層4 a が前記バリスタ素子1 表面上に形成される。また、バリスタ素子1 に副成分として、B i 2 O3 が添加した場合、B i 2 O3 が S i O2 と反応して、主に2 n2 S i O4 からなる高抵抗層4 a と、この高抵抗層4 a の上に、主にB i 4 (S i O4)3 からなる高抵抗層4 b とがバリスタ素子1 の表面上に形成される。

【0025】また、バリスタ素子1の副成分として B_2 O3を添加した場合、 B_2 O3が S_i O2と反応して、主に $Z_{n2}S_i$ O4からなる高抵抗層4aと、この上に、主に B_2 (S_i O4)3からなる高抵抗層4bとがバリスタ素子1の表面上に形成される。

【0026】さらに、バリスタ素子1に、副成分として、Bi2O3とB2O3とを添加した場合、Bi2O3とB2O3とを添加した場合、Bi2O3とB2O3とがSiO2と反応して、主にZn2SiO4からなる高抵抗層4aと、この上に、主にBi4(SiO4)3とB2(SiO4)3とからなる高抵抗層4bとがバリスタ素子1の表面上に形成される。これら反応により生じた物40質は、バリスタの特性への悪影響は生じず、バリスタとして、極めて優れた特性を有するものが得られる。

【0027】 (実施例3) 実施例1と同様にして、面取 (9) 後、図3に示すごとく、SiO2を主成分とする混合物15にバリスタ素子1を埋没させ、この状態で750℃~950℃で5分~10時間、加熱する。加熱後、外部電極3を塗布(10)し、750℃~850℃、10~60分でAg電極焼付、メッキ(14)を行う

【0028】実施例1と同様に、実施例3においても、

バリスタ素子1の主成分2nOと、SiO2が反応して、主にZn2SiO4からなる高抵抗層4aが前記バリスタ素子1表面上に形成される。また、バリスタ素子1に副成分として、Bi2O3を添加した場合、Bi2O3がSiO2と反応して、主にZn2SiO4からなる高抵抗層4aと、この高抵抗層4aの上に、主にBi4(SiO4)3からなる高抵抗層4bとがバリスタ素子1の表面上に形成される。

【0029】また、バリスタ素子1の副成分としてB2 O3を添加した場合、B2O3がSiO2と反応して、主に Zn2SiO4からなる高抵抗層4aと、この上に、主に B2(SiO4)3からなる高抵抗層4bとがバリスタ素子 1の表面上に形成される。

【0030】さらに、バリスタ素子1に、副成分として、Bi2O3とB2O3とを添加した場合、Bi2O3とB2O3とがSiO2と反応して、主にZn2SiO4からなる高抵抗層4aと、この上に、主にBi4(SiO4)3とB2(SiO4)3とからなる高抵抗層4bとがバリスタ素子1の表面上に形成される。これら反応により生じた物質は、バリスタの特性への悪影響は生じず、バリスタとして、極めて優れた特性を有するものが得られる。

【0031】(実施例4)実施例1と同様にして、セラミック素子1を得た後、(CH3O)4Si, (C2H5O)4Si, (C3H7O)4Si, (C4H9O)4Siのうち少なくとも1種類以上含む液体に、セラミック素子1を浸漬させ、その後、空気中あるいは酸素雰囲気中で、700~850℃で30分間焼成して高抵抗層4a,4bを形成した。このようにバリスタ素子1を上記液体に浸漬することにより、この液体が、バリスタ素子1の表面に入り30込み、接触面積が広くなり、反応性が良くなると共に均一な厚さの膜が得られる。

【0033】また、バリスタ素子1の副成分としてB2O3を添加した場合、B2O3がSiO2と反応して、主にZn2SiO4からなる高抵抗層4aと、この上に、主にB2(SiO4)3からなる高抵抗層4bとがバリスタ素子1の表面上に形成される。

【0034】さらに、バリスタ素子1に、副成分として、Bi2O3とB2O3とを添加した場合、Bi2O3とB2O3とあるがSiO2と反応して、主にZn2SiO4からなる高抵抗層4aと、この上に、主にBi4(SiO4)3と50 B2(SiO4)3とからなる高抵抗層4bとがバリスタ素

7

子1の表面上に形成される。これら反応により生じた物質は、バリスタの特性への悪影響は生じず、バリスタとして、極めて優れた特性を有するものが得られる。

【0035】なお実施例1~4においてSiO2を主成分とする混合物15にバリスタ素子1を埋没させる場合、図4のように埋め込むだけでも高抵抗層は形成されるが、反応性を考えた場合、図3のようにアルミナのるつぼ16中で反応させ、さらにおもしなどをして、圧力をかけてSiO2を主成分とする混合物15とバリスタ素子1との密着性を上げた方がよい。また、ニッケル製あるいは磁器製等のバリスタ素子1と反応しない材料でできた容器内にニッケルあるいはジルコニア等のバリスタ素子1と反応しない玉石と、バリスタ素子1とSiO2を主成分とする混合物15とを入れ、回転させながら撹拌して反応を行うと、より均一に反応させることができると思われる。

【0036】また、液体に浸漬したバリスタ素子を実施例 $1\sim3$ と同様に、混合物15に埋没させて、高抵抗層4a, 4bを形成するとさらに均一な厚さを有する緻密なものが形成できる。

【0037】さらに、玉石は、バリスタ素子1よりも小さいものを用いることが好ましい。また混合物15はSiO2を主成分とする粉体であるが、バリスタ素子1との反応性を良くするために、粒径を2μm以下にすることが望ましい。そして、SiO2以外に混合物15に用いる粉体として、マンガン、鉄、ニッケル、アンチモン、アルミニウム、ジルコニア等の酸化物が望ましい。

【0038】この混合比や加熱温度、その時間を調整することにより膜厚を制御できる。また、高抵抗層を形成する際、1200℃以下にすることが望ましい。というのは1200℃を越えるとSiがガラス化してしまい、バリスタ素子1同士がひっついてしまうからである。

【0039】そして昇温を一気に行うことにより、バリスタ素子1の成分が蒸発して、ポアになるのを防ぐことができる。これに対して降温は、特に500~800℃の間は、50℃/hで降温させることが望ましい。これにより、バリスタ素子1の内部に酸素が十分に供給され、低電流領域でのバリスタ特性が向上する。

【0040】また、本発明のバリスタと従来のバリスタの湿中負荷試験を行い、その結果を図5に示した。

【0041】図5を見るとわかるように、従来のバリス タは100時間を過ぎると

[0042]

【外1】

ペリスタ電圧(V 10μA)

【0043】が大きく変化するが、本発明のバリスタは、ほとんど変化していない。このように、本発明のバリスタは従来のものと比較すると非常に耐湿性に優れていることがわかる。

【0044】また、(表2)に、サージ耐量に対する必 50 に優れているので、優れた特性を有するバリスタを得る

8

要な無効層厚みを示している。

[0045]

【表2】

	無効層厚み 有効層厚み	サージ耐量
従来品	2	500(A)
142 7 563	1	200(A)
	1	1000(A)
本発明品	0.5	1000(A)
	0.2	1000(A)

【0046】(表2)によると、従来のバリスタは、もれ電流を防ぐため、サージ耐量が500Aのバリスタでは、無効層の厚みを有効層一層の厚みの2倍に、また200Aのバリスタでは、無効層の厚みを有効層一層の厚みと同じに最低限しなければならなかった。しかし、本発明のバリスタは、サージ耐量が1000Aのバリスタでも、無効層の厚みを有効層一層の厚みの0.2倍にしても、外部電極3とバリスタ素子1の間に高抵抗層4a,4bが介在しているので、もれ電流を防ぐことができる。

【0047】さらに、図1に示した積層型のバリスタの場合、外部電極3とバリスタ素子1の間にも、高抵抗層3aが形成されるので、内部電極2の遊端2aと、対向する外部電極3の距離を短くすることができる。すなわち、内部電極2の面積を大きくすることができるので、サージ耐量の大きなバリスタを得ることができる。

【0048】なお外部電極3の内面側にも高抵抗層3aが形成される理由は現時点で十分判明していないが、バリスタ素子の成分とSiO2とが、反応して液相化し、界面から液相化した高抵抗成分が素子内に浸入するためであると思われる。

[0049]

【発明の効果】以上のように、本発明はバリスタ素子表面の電極に覆れていない部分に、主成分が Z n2 S i O4 の高抵抗層、あるいは下層が Z n2 S i O4を主成分とする高抵抗層、上層が B i 4 (S i O4)3を主成分とする高抵抗層、あるいは下層が Z n2 S i O4を主成分とする高抵抗層、上層が B2 (S i O4)3を主成分とする高抵抗層、上層が Z n2 S i O4を主成分とする高抵抗 が層、上層が Z n2 S i O4を主成分とする高抵抗 なる高抵抗層を形成するものである。

【0050】これらの高抵抗層は、緻密で均一な厚さを有するので不要な水分などがパリスタ素子内に浸入して、パリスタ特性を劣化させることがない。また、メッキ時も、メッキ流れを起こしショート不良が発生するのを防ぐことができる。さらに、無効層の厚みを従来よりも薄くすることができるので、小型化を図ることができる。このように、本発明の高抵抗層は耐薬品性、耐湿性に優れているので、優れた特性を有するパリスタを得る

(6)

ことができる。

【0051】さらに、積層型のバリスタの場合、外部電極とバリスタ素子の間にも、高抵抗層が形成されるので、内部電極の遊端と、対向する外部電極の距離を短くすることができる。すなわち、内部電極の面積を大きくすることができるので、サージ耐量の大きなバリスタを得ることができる。

9

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例におけるバリスタの断面図

【図2】本発明の一実施例におけるバリスタの製造工程 10 図

【図3】本発明の一実施例における焼成工程の説明図

【図4】本発明の一実施例における焼成工程の説明図

10

【図5】本発明の一実施例におけるバリスタの耐湿性を 表す特性曲線図

【符号の説明】

1 バリスタ素子

2 内部電極

2 a 遊端

3 外部電極

3 a 高抵抗層

4 a 高抵抗層

4 b 高抵抗層

【図1】

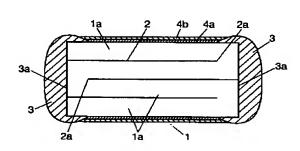
1 バリスタ素子

2 内部電極

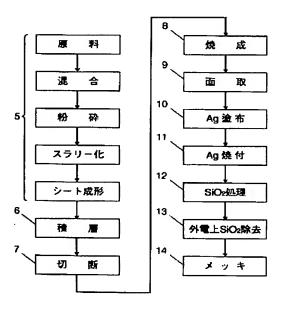
2a 遊鑑

3 外部電極

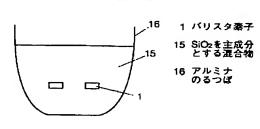
3a, 4a, 4b 高抵抗層



【図2】



【図3】



【図4】 17 アルミナの板 ...15



